

國立中山大學 機電系 測試紀錄單

日期	2023/11/09	設備	表面粗度儀	人員	三朋 張睿民經理 謝呈易 研究生 張子詮、張桓(紀錄)
----	------------	----	-------	----	-----------------------------------

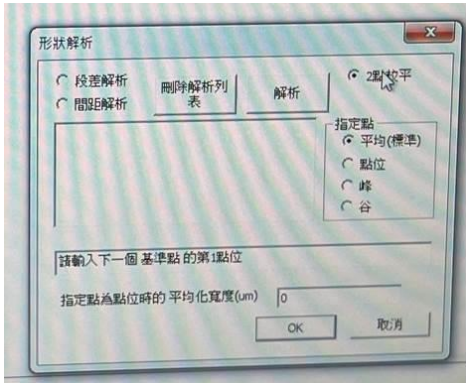
現象敘述

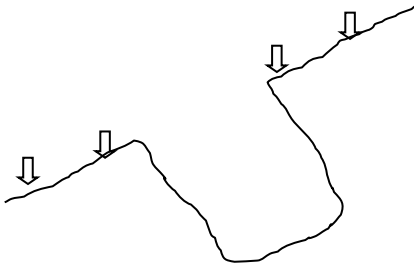
1. 使用段差量測試片與實際尺寸不符
 試片：理論 8um 厚 PI 膜鍍於銅膜上，刮開 PI 膜量測刮槽深，段差應為約 8um
 使用粗度儀量測結果約為 2um，顯有誤差。

處理過程

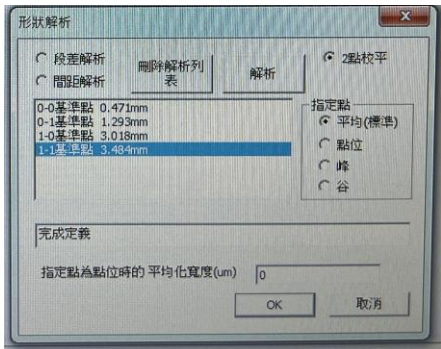
調整量測方法，先將量測結果調整至水平，再進行量測

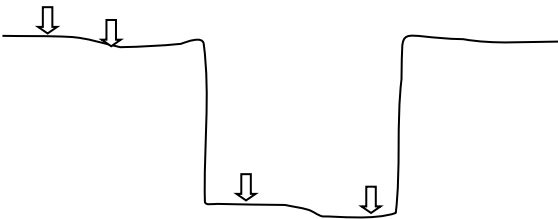
1. 將量測結果調整至水平
 [形狀解析] / 點選[2點校平] / [指定點]選擇[平均(標準)]
 →選擇 2 個基準點
 移動滑鼠點選量測線上的點，先於左側取兩點，再於右側取兩點，則圖形會調至水平





2. 量測段差高度
 →選擇段差解析/ [指定點]選擇[平均(標準)]
 →點選 2 個基準點(如圖示左邊兩點)
 →點選欲測量之點位(如圖示谷底兩點)
 結果實測值與預期相符合。





後續處理

註記